

受託検査業務を始めました

atect

- 豊富な分析・検査装置による試料の評価が可能です。
- 評価専門員によるレポートを提出致します。
- その他、欠陥、構造、組成に関する分析・解析手法をご提案致します。

— 主な検査装置と評価例 —

X線CTスキャン

- X線透過により製品・部品の内部構造状態を非破壊で観察します。
- 最大225 kV, 610 μ AのX線源により、金属・セラミックス部品の検査が可能

粉末X線回折

- 原料粉末、成形体・焼結体の結晶および歪解析が可能です。
- 大気中、不活性ガス雰囲気下で加熱(~ 1500 °C)した際の物質の変化を評価することができます。
- 最大45 kV, 200 mAの高出力X線管球と高感度1次元検出器により、不安定な素材でも迅速に分析が可能です。

粒度分布測定

- レーザー回折法による粒子径の分布測定を行います(17 nm \sim 2500 μ m)。
- 下記2手法により、吸湿素材等に関係なく粒度分布の測定が可能です。
 - 1.湿式法—液体中に分散させて測定する方法
 - 2.乾式法—空気中に噴出・分散させて測定する方法

示差熱分析

- 融解、ガラス転移、昇華、結晶転移等の相転移、脱水、分解等の反応現象を分析します。
- 真空 \sim 大気、不活性ガス下など雰囲気制御下での分析が可能です。
- 常温 \sim 1500 °Cまでの測定により、融点測定による焼結温度の決定、バインダー成分の分解挙動解析、脱脂条件 \sim 金属材料の焼結プロセスの最適化に有効です。

★連絡先 (株)アテクトPIM事業推進部 代表TEL:0748-20-3400★

営業TEL:福島 090-4908-9562 横田 080-3241-4117

e-mail yoshitaka.fukushima@atect.co.jp takehiko.kitamura@atect.co.jp

その他、強度試験機等の各種分析・検査装置を所有しておりますので、ニーズに合わせて対応致します。